

2020年10月1日

各位

双日株式会社

双日、三次元形状測定ソリューションプロバイダーの XTIA に追加出資
～検査プラットフォームの共同開発に着手～

双日株式会社(以下「双日」)は、このたび、ノーベル物理学賞受賞技術「光コム」^{※1)}を世界で唯一事業応用に成功した技術開発ベンチャーである株式会社 XTIA^{※2)}(旧会社名 株式会社光コム、以下「XTIA」)発行の第三者割当増資を引受、同社の検査装置から取得できるデータを活用した検査プラットフォームビジネスを共同で推進することを目的として、同社に追加出資^{※3)}をしました。

年々高まりを見せるインダストリー4.0 ですが、その実現には有効な製造物の計測データの取得およびその活用が不可欠です。これまで XTIA には、検査工程の自動化を目指す顧客企業から、XTIA が提供する非接触式三次元形状測定器の導入後、そこから得られたデータや知見を管理・活用できる人材を確保できないという相談が多く寄せられていました。

そのような課題を解決すべく、双日と XTIA は、データを専門にしない担当者でも、測定器から得られたデータや知見を簡単に管理・活用できる独自検査プラットフォームの共同開発を決定しました。今回の出資資金は、ソフトウェア開発チームの新設などに投資し、検査プラットフォームの構築を加速させていきます。これにより、製造業が抱える人材不足の解消、並びに検査工程の全自動化を全面的にサポートするトータルソリューションの提供を目指します。

また、今回の出資を通して、双日と XTIA はこれまで以上に強固なパートナーシップを構築し、双日の品質検査事業と XTIA が保有する光コム技術を組み合わせ、インダストリー4.0 の実現、検査工程自動化の普及、新たなサービスの創出を図っていきます。

※1) XTIA は、ノーベル物理学賞受賞技術「光コム」を世界で唯一産業応用に成功するなど、独創的かつ高い技術力を有する技術開発ベンチャーです。光コム技術を測定メソッドとして開発、完成させることにより、製造現場における測定・検査の自動化ニーズに応え、インダストリー4.0 の実現に貢献します。自動検査を実現する検査装置の開発・販売、及び、測定メソッドとして光コム技術を提供するなど各社との提携を実施しています。

※2) 光コム技術とは、2005年にノーベル物理学賞を受賞した「世界で最も精度の高いものさし」となる原理です。株式会社XTIAは2008年に世界で唯一となる産業応用に成功しました。製品や技術に関する詳細はホームページを御覧ください。

<https://www.optocomb.com/product/>

※3) 当社リリース、2020年2月21日「双日、三次元形状測定大手のXTIAに出資」をご参照ください。両出資を合算すると、計5億円の出資となります。

以上

(ご参考)

【XTIAの概要】

会社名	株式会社 XTIA (クティア)
設立	2002年4月
所在地	東京都品川区東品川 3-32-42 ISビル 2階
代表者	代表取締役社長 八木 貴郎
主な事業内容	光コム発生器とその応用および関連機器の開発・販売

【リリースに関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404